



专利

国内专利

国外专利

国内专利

专利名称:	示踪磁性纳米颗粒的新方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201010591290.3
申请日期:	2010/12/08
第一发明人:	阎锡蕴
其它发明人:	庄洁、杨东玲、冯静
国外申请方式:	中国
其它备注:	授权

